Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Ufficio G2

Autenticazione di copia di documenti relativi alla domanda di brevetto per: Invenzione Industriale

N. TO2003 A 000115



Si dicniara che i unita copia e conforme ai documenti originali depositati con la domanda di brevetto sopraspecificata, i cui dati risultano dall'accluso processo verbale di deposito.

3 MAR. 2004

Roma, lì.

IL FUNZIONARIO

Giampietro Carlotto JiOluf vebro Liorboldo

Caso 02-CT-480/DP

AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

NS.Rf.2/5526

NS.Rf.2/5526

NS.Rf.2/5526

NO.UI-OCRADI

OCRADI

OCRAD

OCRADI

OCRAD

OCR UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI - ROMA DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE, DEPOSITO RISERVE, ANTICIPATA ACCESSIBILITÀ AL PUBBLICO

1) Denominazione STMICROELECTRONICS S.R.L. Residenza IAGRATE BRIANZA (MI) 2) Denominazione Residenza B. RAPPRESENTANTE DEL RICHIEDENTE PRESSO L'U.I.B.M. cognome e nome BERGADANO MIRKO e altri denominazione studio di appartenenza STUDIO TORTA S.r.I. via Viotti In. (0:00.9) città I	codice
2) Denominazione Residenza B. RAPPRESENTANTE DEL RICHIEDENTE PRESSO L'U.I.B.M. cognome e nome BERGADANO MIRKO e altri denominazione studio di appartenenza STUDIO TORTA S.r.I. via Viotti In. (0,00,9) città	codice Liliania
Residenza B. RAPPRESENTANTE DEL RICHIEDENTE PRESSO L'U.I.B.M. cognome e nome BERGADANO MIRKO e altri denominazione studio di appartenenza STUDIO TORTA S.r.I. via Viotti n. 0,00,9 città	
B. RAPPRESENTANTE DEL RICHIEDENTE PRESSO L'U.I.B.M. cognorne e nome (BERGADANO MIRKO e altri denominazione studio di appartenenza (STUDIO TORTA S.r.I. via Viotti n. (0,00,9) città (
cognome e nome BERGADANO MIRKO e altri denominazione studio di appartenenza STUDIO TORTA S.r.l. via Viotti n. (0,00,9) città	cod. fiscale
cognome e nome BERGADANO MIRKO e altri denominazione studio di appartenenza STUDIO TORTA S.r.l. via Viotti n. (0,00,9) città	cod. fiscale
denominazione studio di appartenenza STUDIO TORTA S.r.I. via Viotti n. (0,00,9) città	cod. riscale
via Viotti n. (0,00,9) città i	
	TODINO : 14 0/4 0 4: := d
C. DOMICILIO ELETTIVO destinatorio	TORINO cap 1,0,1,2,1 (prov) T,O
via	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	o/sottogruppo
METODO DI SOFT-PROGRAMMAZIONE PER UN DISPOSITIVO D	
ELETTRICAMENTE E DISPOSITIVO DI MEMORIA NON VOLATI	LE CANCELLABILE ELETTRICAMENTE
IMPLEMENTANTE TALE METODO DI SOFT-PROGRAMMAZIONE	
ANDRAIDADA AAADAARII ITA AA MARAAAAA AA	
ANTICIPATA ACCESSIBILITÀ AL PUBBLICO: SI L. NO L. S. INVENTORI DESIGNATI cognome nome	SEISTANZA: DATA
	ovgranie notite
2) MESSINA Marco	
F. PRIORITÀ	SCIOGLIMENTO RISERVE
nazione o organizzazione tipo di priorità numero di domenda	allegato data di deposito S/R Data N° Protocolio
1)	
2)	
G. CENTRO ABILITATO DI RACCOLTA COLTURE DI MICRORGANISMI, denominazione	
Per la migliore comprensione dell'invenzione è stato nec convenuto dalla Convenzione Europea sulle formalità alle DOCUMENTAZIONE ALLEGATA N. es. Doc. 1) 1 PROV n. pag. 30 riassunto con disegno principale, descrizione e rivendic Doc. 2) 1 PROV n. tav. 10:4 disegno (obbligatorio se citato in descrizione, 1 esempla designazione inventore procura generale designazione inventore documenti di priorità con traduzione in italiano mominativo completo dei richiedente 3) attestati di versamento, totale Euro Duecentonovantuno/80 COMPILATO IL (1,7) 10.2; 12.00.3; FIRMA DEL (1) RICHIEDENTE (1)	arguali l'Italia ha aderito. SCIOGLIMENTO RISERVE Data N° Protocolio L' / L'
(,	GADANO MIRKO
DEL PRESENTE ATTO SI RICHIEDE COPIA AUTENTICA SUNO SIL	
CAMERA DI COMMERCIO IND. ART. AGR. DI	0.01 1 5

Classe proposta (sez./cl./scl/)

RIASSUNTO INVENZIONE CON DISEGNO PRINCIPALE

I AGRATE BRIANZA (MI)

IMPLEMENTANTE TALE METODO DI SOFT-PROGRAMMAZIONE

(gruppo/sottogruppo)

L. RIASSUNTO

NUMERO DOMANDA

NUMERO BREVETTO

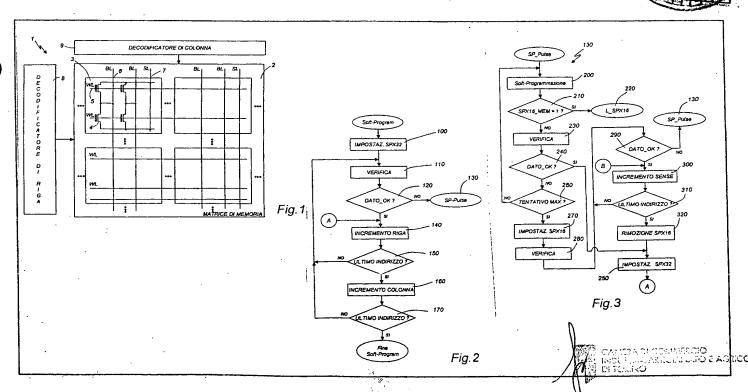
A. RICHIEDENTE (1)

Denominazione

Residenza D. TITOLO METODO DI

> Viene descritto un metodo di soft-programmazione per un dispositivo di memoria non volatile cancellabile elettricamente, in cui la sost-programmazione viene effettuata con una molteplicità di soft-programmazione pari al doppio di quella utilizzata per la scrittura di dati nel dispositivo di memoria fino a quando la corrente assorbita durante la sost-programmazione è minore o uguale alla massima corrente, disponibile per le operazioni di scrittura, che può essere generata all'interno del dispositivo di memoria, e con una molteplicità di soft-programmazione pari a quella utilizzata per la scrittura di dati nel dispositivo di memoria nel caso in cui la corrente assorbita durante la soft-programmazione con molteplicità doppia è maggiore della massima corrente, disponibile per le operazioni di scrittura, che può essere generata all'interno del dispositivo di memoria.

M. DISEGNO



(Iscritto all' Albo n. 8438)

DESCRIZIONE

del brevetto per invenzione industriale di STMICROELECTRONICS S.R.L. di nazionalità italiana,

10

15

5 con sede a 20041 AGRATE BRIANZA (MILANO), VIA C. OLIVETTI, 2
Inventori: LA MALFA Antonino, MESSINA Marco

La presente invenzione è relativa ad un metodo di soft-programmazione per un dispositivo di memoria non volatile cancellabile elettricamente e ad un dispositivo di memoria non volatile cancellabile elettricamente implementante tale metodo di cancellazione.

Come è noto, le memorie non volatili comprendono vo

È altresì noto che in una cella di memoria non 20 volatile del tipo a porta flottante, la memorizzazione di uno stato logico viene effettuata programmando la memoria stessa soglia della cella di tensione di la definizione della quantità di attraverso 25 immagazzinata nella regione di porta elettrica

flottante.

10

A seconda dell'informazione memorizzata, le celle di memoria si distinguono in celle di memoria cancellate (stato logico memorizzato "1"), in cui nella regione di porta flottante non viene immagazzinata alcuna carica elettrica, e in celle di memoria scritte o programmate (stato logico memorizzato "0"), in cui nella regione di porta flottante viene immagazzinata una carica elettrica sufficiente a determinare un aumento sensibile della tensione di soglia delle celle di memoria stesse.

Nelle memorie non volatili, inoltre, la matrice di memoria è generalmente suddivisa in settori formati, ciascuno, da un insieme di celle di memoria sulle quali possibile effettuare simultaneamente una stessa 15 operazione, operazione di generalmente una cancellazione. In particolare, nelle memorie non volatili organizzate a settori è possibile effettuare la lettura e la programmazione di singole celle di memoria di un settore e la cancellazione simultanea di tutte le 20 celle di memoria del settore, e quest'ultima operazione è resa possibile dal fatto che le celle di memoria appartenenti settore presentano ad uno stesso terminali di sorgente collegati fra loro.

Nella figura 1 è a titolo di esempio mostrata in 25 maniera schematica l'architettura di un dispositivo di

memoria del tipo sopra descritto, in cui con 1 è indicato, nel suo complesso, il dispositivo di memoria non volatile stesso, con 2 è indicata la matrice di memoria, con 3 sono indicati i settori della matrice di memoria 3, con 4 sono indicate le celle di memoria, con 5 sono indicate le linee di parola, con 6 sono indicate le linee di bit, con 7 è indicata la linea comune alla quale sono collegati i terminali di sorgente di tutte le celle di memoria 8 appartenenti ad uno stesso settore 4, con 8 è indicato il decodificatore di riga, ed infine con 9 è indicato il decodificatore di colonna.

5

10

15

20

cancellazione di una volatile memoria non effettuata per settori è un'operazione cumulativa, ossia agisce contemporaneamente ed indistintamente su tutte le celle di memoria del settore, ed è molto complessa da preparativi solo alcuni quanto richiede non effettuarsi prima di eseguire la cancellazione vera e propria, in cui vengono estratte le cariche elettriche presenti nella regione di porta flottante e ridotta di conseguenza la tensione di soglia delle celle di memoria stesse, ma richiede anche delle verifiche possibili modifiche successive alla cancellazione vera e propria nel caso in cui il risultato della cancellazione stessa non sia pienamente soddisfacente.

In particolare, per la cancellazione di un settore

un'operazione di si effettua innanzitutto precondizionamento, nota anche con il nome di "programall-0", cioè una operazione con la quale tutte le celle di memoria del settore vengono portate nello stato programmato indipendentemente dal loro stato attuale. Ciò è dovuto al fatto che se si cancellasse un settore in cui alcune delle celle di memoria sono scritte ma di altre sono già cancellate, durante la fase cancellazione si determinerebbe una sovracancellazione delle celle di memoria già cancellate, le quali con memoria buona probabilità diventerebbero celle di deplete, ossia celle di memoria aventi tensione soglia negativa e quindi drenanti una corrente anche quando il loro terminale di porta è posto ala tensione di massa, le quali risultano particolarmente fastidiose in quanto simulano la presenza costante di celle di memoria cancellate sulle rispettive colonne appartengono e quindi fanno sì che tutte le celle di memoria appartenenti a tali colonne vengano lette come cancellate indipendentemente dal loro stato reale.

10

15

20

25

Per evitare tale fenomeno e uniformare la storia di tutte le celle di memoria appartenenti allo stesso settore, si procede quindi alla scrittura dell'intero settore e quindi, a seguito dell'operazione di precondizionamento, tutte le celle di memoria del

settore risultano programmate.

10

15

20

25

Successivamente viene eseguita la fase di cancellazione vera e propria, durante la quale vengono estratte le cariche elettriche presenti nella regione di porta flottante e ridotta di conseguenza la tensione di soglia delle celle di memoria stesse.

Per effettuare ciò, fra il terminale di sorgente ed il terminale di porta di ciascuna cella di memoria viene applicato un elevato campo elettrico tale da consentire agli elettroni di abbandonare la regione di porta flottante grazie al cosiddetto effetto tunnel di Fowler-Nordheim.

L'applicazione dei potenziali elettrici necessari all'estrazione di cariche elettriche dalla regione di porta flottante può avvenire in diversi modi. Una delle metodologie che può ad esempio essere utilizzata per l'estrazione di cariche elettriche dalla regione di porta flottante è conosciuta in letteratura con il nome "cancellazione gate negativa" con essenzialmente di lasciare flottante il terminale pozzo della cella di da cancellare di memoria applicare al terminale di porta un impulso di tensione negativo avente tipicamente un ampiezza di 10 durata temporale dell'ordine di 10 ms, ed ai terminali di sorgente e di substrato ("body") una successione di

impulsi di tensione la cui ampiezza è variabile a gradinata fra un valore minimo pari a 3 V ed un valore massimo pari a 8 V con ampiezza del gradino di 300 mV.

Al termine dell'impulso di cancellazione, quindi eseguita una operazione di verifica su tutte le celle di memoria del settore per controllare il valore delle loro tensioni di soglia e tale verifica viene effettuata eseguendo una lettura marginata garantisca il corretto riconoscimento della cella di memoria nella normale modalità di lettura.

5

10

15

20

In particolare, l'operazione di verifica scandisce tutte le celle di memoria del settore e si interrompe $\frac{Q}{Q}$ allorquando viene trovata una cella di memoria che non supera il test. A questo punto si passa all'applicazione del successivo impulso di cancellazione.

Pertanto, la fase di cancellazione procede con l'applicazione di un impulso di cancellazione seguita da una successiva fase di verifica fino a quando tutte le celle di memoria presentano una tensione di soglia inferiore ad una tensione di soglia di riferimento, la quale è la tensione di soglia della cella di memoria di riferimento utilizzata durante l'operazione di verifica.

Una volta che gli impulsi di tensione applicati ai terminali di sorgente e di substrato hanno raggiunto la 25 loro ampiezza massima, se le celle di memoria del settore non risultano ancora tutte cancellate, allora è prevista una seconda fase di pura cancellazione elettrica durante la quale sia ai terminali di porta che ai terminali di sorgente e di substrato delle celle di memoria del settore vengono applicati ulteriori impulsi di cancellazione, fino ad un numero massimo determinato, in cui l'ampiezza degli impulsi applicati ai terminali di sorgente e di substrato delle celle di memoria è pari all'ampiezza massima prevista.

10 della fase di pura cancellazione termine elettrica, tutte le celle di memoria del settore presentano tensioni di soglia aventi una distribuzione a sostanzialmente di gaussiana alla quale sovrappone una eventuale "coda" dovuta alle celle di 15 memoria deplete.

La fase di cancellazione del settore non può però ritenersi ancora conclusa perché risulta ancora necessario assicurarsi che non vi siano celle di memoria deplete che possono indurre errori durante la fase di lettura. Come precedentemente detto, infatti, tali celle di memoria, avendo una tensione di soglia negativa e quindi drenando una corrente anche quando il loro terminale di porta è posto alla tensione di massa, possono falsare la successiva operazione di lettura del dispositivo di memoria in quanto simulano la presenza

20

25

costante di celle di memoria cancellate sulle rispettive colonne a cui appartengono e quindi fanno sì che tutte le celle di memoria appartenenti a tali colonne vengano lette come cancellate indipendentemente dal loro stato reale.

5

10

15

20

25

Pertanto, la fase di cancellazione vera e propria è seguita da una fase di ricerca e di riprogrammazione delle celle di memoria deplete, nota anche col nome di fase di "soft-program", in cui viene verificata la presenza di una corrente di perdita sulle colonne della matrice di memoria, polarizzando tutte le righe della matrice stessa alla tensione di massa.

Quando viene individuata una colonna presentante tale anomalia, allora viene indirizzata la prima cella di memoria della colonna ed al suo terminale di porta viene applicato un impulso di programmazione avente una leggermente ampiezza prefissata per spostare verso valori più alti la soglia della cella di memoria stessa. Successivamente, si procede con la lettura della seconda cella di memoria della stessa colonna: se non vi è presenza di corrente di perdita nella cella di memoria allora ciò significa che la cella di memoria depleta era quella precedente che è stata già recuperata, altrimenti si procede a programmare la cella di memoria considerata e così via fino al termine della colonna.



termine della colonna, viene quindi Giunti al ripetuta l'operazione di verifica e, in sia presente ancora una corrente di perdita, la procedura ripetuta aumentando descritta viene sopra l'ampiezza dell'impulso di programmazione applicato al terminale di porta delle celle di memoria durante la programmazione.

5

10

15

20

25.

Nella pratica la soft-programmazione non viene mai effettuata su una singola cella di memoria per volta bensì su un determinato numero di celle di memoria per di circuiti volta legato al numero che è programmazione ("Program Loads") di cui il dispositivo sedici. è provvisto, attualmente memoria esequita particolare, soft-programmazione viene la indirizzando un numero di celle di memoria pari al numero di Program Load e soft-programmando soltanto quelle celle di memoria indirizzate che necessitano effettivamente di tale operazione. Il numero di celle di memoria che vengono contemporaneamente soft-programmate generalmente noto in campo tecnico col nome 'di parallelismo o molteplicità di soft-programmazione.

Per competere nei settori di mercato emergenti dei apparecchi elettronici portatili quali, ad esempio, i lettori MP3 e le fotocamere digitali, i dispositivi di memoria non volatili sono attualmente soggetti ad una

revisione delle loro specifiche tradizionali, in particolare sono oggetto di studi approfonditi volti, fra l'altro, a ridurre il tempo di cancellazione.

Un contributo alla riduzione del tempo di cancellazione potrebbe venire dalla riduzione del tempo di soft-programmazione, la quale, almeno in linea di principio, potrebbe essere ottenuta aumentando il parallelismo con cui tale operazione viene realizzata.

5

20

Ad esempio, la riduzione del tempo di soft
10 programmazione potrebbe essere ottenuta semplicemente
raddoppiando il numero di Program Load, ma ciò
comporterebbe, nel caso in cui tutte le celle di memoria
indirizzate necessitassero di essere soft-programmate,
un raddoppio della corrente assorbita nella fase di
soft-programmazione.

Per generare tale corrente si potrebbe agire in due modi: o generare la corrente necessaria all'esterno del dispositivo opportuno di memoria, utilizzando un generatore di corrente, e fornirla ad un apposito dispositivo di stesso, piedino del memoria raddoppiare la dimensione della pompa di carica che nel dispositivo di memoria è dedicata alla generazione di elevate correnti.

La prima soluzione risulta però essere in 25 controtendenza rispetto all'attuale mercato dei dispositivi di memoria a semiconduttore che richiede invece di diminuire sia il numero di alimentazioni presenti nel dispositivo di memoria che il loro valore assoluto di tensione, mentre la seconda soluzione porterebbe ad un aumento significativo dell'area occupata dalla pompa di carica su silicio e quindi ad un aumento del costo del dispositivo di memoria.

5

10

15

20

25

Scopo della presente invenzione è quello di fornire un metodo di cancellazione di un dispositivo di memoria non volatile che consenta una riduzione dei tempi di cancellazione rispetto ai dispositivi di memoria non volatili secondo l'arte nota.

Ulteriore scopo della presente invenzione è quello di realizzare un dispositivo di memoria non volatile che presenti tempi di cancellazione inferiori rispetto a quelli dei dispositivi di memoria non volatili secondo l'arte nota.

Secondo la presente invenzione viene fornito un metodo di soft-programmazione per un dispositivo di memoria non volatile cancellabile elettricamente, come definito nella rivendicazione 1.

Secondo la presente invenzione viene inoltre realizzato un dispositivo di una memoria non volatile cancellabile elettricamente, come definito nella rivendicazione 9.

Per una migliore comprensione della presente invenzione viene ora descritta una forma di realizzazione preferita, a puro titolo di esempio non limitativo e con riferimento ai disegni allegati, nei quali:

- la figura 1 mostra l'architettura di un dispositivo di memoria non volatile; e

5

10

15

20

25

- le figure 2, 3 e 4 mostrano diagrammi di flusso delle operazioni relative al metodo di cancellazione secondo la presente invenzione.

La presente trae spunto dal risultato di uno studio effettuato dalla richiedente sulla distribuzione statistica delle celle di memoria deplete presenti nei dispositivi di memoria non volatile. In particolare, tale studio ha evidenziato che il numero di celle di deplete in un dispositivo memoria di memoria volatile è in media pari al 5% del numero totale di celle di memoria della matrice di memoria, che le celle di memoria deplete generalmente non sono uniformemente distribuite all'interno della matrice di memoria ma bensì sono localizzate in una determinata zona della matrice di memoria stessa, e che questo differente comportamento (depletion) di alcune celle di memoria di un settore della matrice di memoria rispetto a quello della restante parte delle celle di memoria del settore è spiegabile con una difettosità localizzata in una determinata area di silicio su cui la matrice di memoria è realizzata.

5

10

15

20

25

Grazie a ciò ed al fatto che tipicamente i bit di una parola tipicamente non sono memorizzati in celle di adiacenti di un settore ma bensì memorizzati in celle di memoria distribuite differenti zone del settore secondo un determinato criterio (ad esempio spaziate di 128 colonne dall'altra, per un dispositivo costituito colonne), statisticamente la probabilità che un elevato numero di celle di memoria memorizzanti i bit di una stessa parola risultino deplete è estremamente ridotta, per cui tipicamente si hanno errori di lettura solo alcuni dei bit di una parola memorizzata.

In altre parole, la distribuzione della memorizzazione dei bit di un stessa parola all'interno di un settore della matrice di memoria combinata con il fatto che le difettosità del silicio su cui la matrice è realizzata sono tipicamente di memoria localizzato rende estremamente improbabile che elevato numero di celle di memoria memorizzanti i bit di una stessa parola ricadano all'interno di una stessa area di silicio difettosa, per cui tipicamente solamente qualche bit della parola sarà affetto dal problema della depletion.

5

10

15

20

25

Traendo quindi spunto dalle constatazioni sperimentali sopra evidenziate, l'idea alla base della presente invenzione è semplicemente quella di soft-programmare e di verificare le celle di memoria con una molteplicità doppia (ad esempio 32) rispetto a quella utilizzata in programmazione (ad esempio 16), senza necessità di fornire dall'esterno la maggiore corrente necessaria o di aumentare le dimensioni della pompa di carica interna al dispositivo di memoria.

Ciò può essere effettuato in maniera semplice modificando opportunamente l'algoritmo di programmazione in modo che operi sia con la molteplicità utilizzata in programmazione che con una molteplicità doppia rispetto ad essa. In particolare, funzionamento normale l'algoritmo di soft-programmazione opera a molteplicità doppia (nell'esempio considerato 32 bit), ossia a velocità massima, mentre nel caso in cui vi sia un numero eccessivo di celle di memoria deplete e non si riesca a soft-programmare contemporaneamente il numero di celle di memoria previste nel funzionamento a molteplicità doppia perché la corrente massima richiesta capacità della eccede la pompa di carica, l'algoritmo di soft-programmazione passa ad operare a molteplicità singola, ossia molteplicità con la

utilizzata in programmazione (nell'esempio considerato 16 bit), in cui la pompa di carica è in grado di fornire la corrente massima richiesta.

Dopo che sono stati programmati in molteplicità singola due gruppi di celle di memoria (nell'esempio considerato due gruppi di 16 celle di memoria ciascuno), l'algoritmo di soft-programmazione ritorna ad operare a molteplicità doppia.

5

Si può facilmente verificare che, chiamando w il numero di bit di cui è composta una parola, b il numero di bit memorizzati in celle di memoria deplete, nel seguito per brevità chiamati bit depleti, e p la funzione densità di probabilità di trovare b bit depleti su w bit, con p=100*Fp(b) $0 \le p \le 100$ e $0 \le b \le w$, se si vuole che l'algoritmo di soft-programmazione passi a molteplicità inferiori alla massima per il a% delle volte, per una singola programmazione deve essere p > a, cioè:

$$100 \cdot Fb(p) > a \Rightarrow b = FB^{-1}\left(\frac{a}{100}\right)$$

20 dove b è il numero massimo di bit depleti per parola che si trova il a% delle volte.

Se si indica con B il numero massimo di bit che si è in grado di soft-programmare per volta, che nella fattispecie coincide con w, la molteplicità massima che

si può raggiungere è:

$$N = INT \left(\frac{B}{b}\right) = INT \left(\frac{B}{Fb^{-1} \left(\frac{a}{100}\right)}\right) \cong INT \left(\frac{w}{Fb^{-1} \left(\frac{a}{100}\right)}\right)$$

Prendendo ad esempio in considerazione un dispositivo di memoria realizzato con un processo di fabbricazione flash noto con la sigla t7x dove le celle di memoria deplete risultano essere il 4,3% del totale, da un'analisi statistica sui dispositivi di memoria tipici si è ottenuta la seguente funzione densità di probabilità:

	$P(b \le 0) = 50,78$	$P(b \le 9) = 0,000$
•	$P(b \le 1) = 17,96$	$P(b \le 10) = 0,00$
	$P(b \le 2) = 3,125$	$P(b \le 11) = 0,00$
	$P(b \le 3) = 0,781$	$P(b \le 12) = 0,00$
15	$P(b \le 4) = 0,000$	$P(b \le 13) = 0,00$
	$P(b \le 5) = 0,000$	$P(b \le 14) = 0,00$
	$P(b \le 6) = 0,000$	$P(b \le 15) = 0,00$
	$P(b \le 7) = 0,000$	$P(b \le 16) = 0,00$
	$P(b \le 8) = 0,000$	

Quindi, se si desidera che la probabilità di passare a molteplicità inferiori sia del 4%, allora si ha b=2, e per w=16 si ottiene N=4, per un totale di N*w=4*16=64 bit soft-programmabili per volta \overline{N}

Se si utilizza invece N=2, per w=16 (N*w=2* 16=32 bit soft-programmabili per volta) si ha b=4 con una probabilità di passare a molteplicità N=1 (N*w=1*16=16 bit soft-programmabili per volta) circa nulla.

5

20

25

Vediamo ora nello specifico, con riferimento ai digrammi di flusso di figure 2, 3 e 4, come deve essere modificato l'algoritmo di soft-programmazione per implementare l'idea alla base della presente invenzione.

In particolare, nella figura 2 è mostrato il diagramma di flusso delle operazioni relative alla routine principale dell'algoritmo di soft-programmazione secondo la presente invenzione ed indicata in figura 1 con "Soft-Program", mentre nelle figure 3 e 4 sono mostrate due routine chiamate dalla routine principale "Soft-Program" ed indicate rispettivamente con "SP_Pulse" e "L SPX16".

Inoltre, per semplicità descrittiva verrà preso in considerazione il caso in cui la soft-programmazione venga effettuata con una molteplicità singola a 16 bit e con una molteplicità doppia a 32 bit. Risulterà tuttavia immediatamente chiaro al lettore come quanto detto a riguardo dell'esempio preso in considerazione nelle figure 2, 3 e 4, sia applicabile tale e quale a qualsiasi molteplicità di soft-programmazione singola e

doppia di adottino.

5

10

15

20

25

la routine riferimento alla figura 2. Con principale "Soft-Program" prevede che venga inizialmente impostata la molteplicità di soft-programmazione doppia a 32 bit e la molteplicità di soft-programmazione in uso viene memorizzata in una opportuna variabile SPX16 MEM (blocco 100). In particolare, la variabile SPX16_MEM è una variabile utilizzata per modificare il flusso delle di softdella molteplicità operazioni а seconda programmazione impostata e viene settata ad un primo valore logico, ad esempio "1", se risulta impostata la molteplicità di soft-programmazione singola a 16 bit e ad un secondo valore logico, nell'esempio considerato "0", se risulta impostata la molteplicità di programmazione doppia a 32 bit.

Dopodiché, viene applicato un impulso di verifica ad un numero di celle di memoria pari alla molteplicità di soft-programmazione impostata (blocco 110), ossia 32 celle di memoria se la variabile SPX16_MEM assume il valore logico "0" oppure 16 celle di memoria se la variabile SPX16_MEM assume il valore logico "1", e viene quindi verificato se vi sono celle di memoria deplete o se invece tutte le celle di memoria risultano cancellate (blocco 120). Ad esempio, l'esito di tale verifica può convenientemente essere memorizzato in un indicatore di

stato logico (flag), in figura indicato con "DATO_OK", che viene settato ad un primo valore logico, ad esempio "0", se vi sono celle di memoria deplete, e ad un secondo stato logico, nell'esempio considerato "1", se tutte le celle di memoria risultano cancellate.

5

10

15

20

. 25

Se vi sono celle di memoria deplete (uscita NO del blocco 120), allora viene eseguita la routine SP Pulse, il cui diagramma di flusso è mostrato nella figura 2, softrealizzata la attraverso la quale viene programmazione delle celle di memoria con molteplicità di soft-programmazione singola o doppia (blocco 130), mentre se tutte le celle di memoria risultano cancellate (uscita SI del blocco 120), allora viene indirizzata la riga successiva (blocco 140) e viene quindi verificato se è stato raggiunto l'ultimo indirizzo di riga (blocco l'ultimo indirizzo di riga non è 150). Se raggiunto (uscita NO dal blocco 150) allora si perviene nuovamente al blocco 110, mentre se l'ultimo indirizzo di riga è stato raggiunto (uscita SI dal blocco 150) allora viene indirizzata la colonna successiva (blocco 160) e viene verificato se è stato raggiunto l'ultimo indirizzo di colonna (blocco 170). Se l'ultimo indirizzo di colonna non è stato raggiunto (uscita NO dal blocco 170) allora si perviene nuovamente al blocco 110, mentre l'ultimo indirizzo di colonna è stato raggiunto (uscita SI dal blocco 170) allora la routine principale "Soft-Program" termina.

Nella figura 3 è mostrato il diagramma di flusso delle operazioni relative alla routine SP_Pulse.

Secondo quanto mostrato nella figura 3, la routine SP_Pulse prevede inizialmente che venga effettuata la soft-programmazione di un numero di celle di memoria pari alla molteplicità di soft-programmazione impostata e memorizzata nella variabile SPX16_MEM (blocco 200).

Dopodiché, viene verificato il contenuto della variabile SPX16_MEM che memorizza la molteplicità di soft-programmazione impostata (blocco 210).

Se risulta essere impostata la molteplicità di soft-programmazione singola a 16 bit (uscita SI blocco 210), allora viene eseguita la routine L_SPX16 (blocco 220), il cui diagramma di flusso è ancora mostrato nella figura 2, mentre se risulta essere impostata la molteplicità di soft-programmazione doppia a 32 bit (uscita NO dal blocco 210), allora viene applicato un impulso di verifica ad un numero di celle di memoria pari alla molteplicità di soft-programmazione impostata (blocco 230), ossia 32 celle di memoria, e viene quindi verificato se fra esse vi sono celle di memoria deplete o se invece queste risultano

25 cancellate (blocco 240).

5

15

20

Se tutte le celle di memoria a cui è stato applicato l'impulso di verifica risultano cancellate (uscita SI del blocco 240), allora viene impostata la molteplicità di soft-programmazione doppia a 32 bit (blocco 250) e si ritorna al blocco 140 della routine principale "Soft-Program", mentre se fra le celle di memoria a cui è stato applicato l'impulso di verifica risultano esserci celle di memoria deplete (uscita NO del blocco 240), allora viene verificato se è stato raggiunto un numero massimo di tentativi di soft-programmazione prestabilito (blocco 260).

5

10

Se tale numero massimo di tentativi non è ancora Nata de la stato raggiunto (uscita NO blocco 260), allora si perviene nuovamente al blocco 200, mentre se il numero massimo di tentativi risulta esser stato raggiunto (uscita SI blocco 260), allora viene forzata la molteplicità di soft-programmazione singola a 16 bit e ciò viene memorizzato nella variabile SPX16_MEM (blocco 270).

Dopodiché, viene applicato un impulso di verifica ad un numero di celle di memoria pari alla molteplicità di soft-programmazione corrente (16 bit) (blocco 280) e viene quindi verificato se fra queste vi sono celle di memoria deplete o se invece queste risultano tutte cancellate (blocco 290).

Se fra le celle di memoria a cui è stato applicato l'impulso di verifica risultano esserci celle di memoria 290), deplete (uscita NO del blocco allora viene richiamata nuovamente la routine SP Pulse, mentre 5 tutte le celle di memoria a cui è stato applicato l'impulso di verifica risultano cancellate (uscita SI del blocco 290), allora viene selezionato il successivo gruppo di 16 celle di memoria (blocco 300) e viene quindi verificato è 1'ultimo se stato raggiunto 10 indirizzo di riga o di colonna (blocco 310). Se l'ultimo indirizzo di riga o di colonna non è stato raggiunto (uscita NO dal blocco 310) allora le operazioni quelle descritte in riprendono da precedenza riferimento al blocco 290, mentre se l'ultimo indirizzo 15 di riga o di colonna è stato raggiunto (uscita SI dal blocco 310) allora viene rimossa la forzatura ("clear") della molteplicità di soft-programmazione singola a 16 bit e la memorizzazione di tale molteplicità effettuate nel blocco 270 (blocco 320).

Dopodiché, si perviene nuovamente al blocco 250 precedentemente descritto, in cui viene nuovamente impostata la molteplicità di soft-programmazione doppia a 32 bit, e da questo si giunge quindi al blocco 140 della routine principale "Soft-Program".

Nella figura 4 è mostrato il diagramma di flusso

delle operazioni relative alla routine L_SPX16.

Secondo quanto mostrato nella figura 4, la routine L_SPX16 prevede che inizialmente venga applicato un impulso di verifica ad un numero di celle di memoria pari alla molteplicità di soft-programmazione corrente (16 bit) (blocco 400) e che quindi venga verificato se vi sono celle di memoria deplete o se invece tutte le celle di memoria risultano cancellate (blocco 410).

Se tutte le celle di memoria risultano cancellate (uscita SI del blocco 410), allora viene forzata la 10 molteplicità di soft-programmazione singola a 16 bit, la quale viene anche memorizzata nella variabile SPX16_MEM (blocco 420), mentre se vi sono celle di memoria deplete (uscita NO del blocco 410), allora viene verificato se è di tentativi numero massimo un 15 stato raggiunto prestabilito (blocco 430).

Se tale numero massimo di tentativi non è ancora stato raggiunto (uscita NO blocco 430), allora viene richiamata la routine "SP_Pulse", mentre se il numero massimo di tentativi risulta esser già stato raggiunto (uscita SI blocco 430), allora si perviene al blocco 420, in cui viene formata la molteplicità di soft-programmazione singola a 16 bit, e da questo si giunge quindi al blocco 300 della routine "SP_Pulse".

20

25 Da un esame delle caratteristiche del metodo di

cancellazione secondo la presente invenzione sono evidenti i vantaggi che esso consente di ottenere.

In particolare, il presente metodo di cancellazione consente di ottenere un tempo di soft-programmazione inferiore di circa il 50% rispetto a quello ottenibile con gli attuali algoritmi di soft-programmazione e di conseguenza un tempo di cancellazione totale inferiore di circa il 5% rispetto a quello che si ha negli attuali dispositivi di memoria, senza la necessità di dover sovradimensionare gli elevatori di tensione per fornire la corrente necessaria nel caso peggiore.

10

15

20

Sfruttando la proprietà della distribuzione statistica delle celle di memoria deplete risulta quindi possibile dimezzare il tempo di soft-programmazione a parità di area occupata su silicio.

Inoltre, dato che, per altre necessità, tipicamente nei dispositivi di memoria non volatili sono già previsti un numero di Program Load doppio rispetto a quello strettamente necessario in programmazione, l'implementazione della presente invenzione non richiede nemmeno l'introduzione di ulteriori Program Load.

Se invece lo spazio su silicio lo consente, raddoppiando il numero di Program Load già presenti sui dispositivi di memoria si potrebbe ridurre ulteriormente

25 il tempo di soft-programmazione e quindi

complessivo di cancellazione.

Risulta infine chiaro che al metodo di cancellazione qui descritto ed illustrato possono essere apportate modifiche e varianti senza per questo uscire dall'ambito protettivo della presente invenzione, come definito nelle rivendicazioni allegate.

RIVENDICAZIONI

- 1. Metodo di soft-programmazione per un dispositivo di memoria non volatile cancellabile elettricamente, caratterizzato dal fatto che la detta soft-5 programmazione viene effettuata con prima una molteplicità di soft-programmazione in determinate condizioni operative e con una seconda molteplicità di soft-programmazione differente dalla prima molteplicità di soft-programmazione nel caso in cui dette determinate 10 condizioni operative non risultino presenti.
 - 2. Metodo di soft-programmazione secondo la rivendicazione 1, in cui la detta prima molteplicità di soft-programmazione è maggiore di quella utilizzata per la scrittura di dati nel dispositivo di memoria.
- 3. Metodo di soft-programmazione secondo la rivendicazione 1 o 2, in cui la prima molteplicità di soft-programmazione è doppia rispetto a quella utilizzata per la scrittura di dati nel dispositivo di memoria.
- 4. Metodo di soft-programmazione secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, in cui la seconda molteplicità di soft-programmazione è minore della prima molteplicità di soft-programmazione.
- 5. Metodo di soft-programmazione secondo una 25 qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, in cui la

seconda molteplicità di soft-programmazione è uguale a quella utilizzata per la scrittura di dati nel dispositivo di memoria.

- Metodo di. soft-programmazione secondo 5 qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, in cui la soft-programmazione prima molteplicità di utilizzata nel caso in cui la corrente assorbita durante soft-programmazione effettuata con detta molteplicità soft-programmazione soddisfi una di 10 determinata relazione.
- 7. Metodo di soft-programmazione secondo la rivendicazione 6, in cui la detta relazione è definita dalla condizione che la corrente assorbita durante la soft-programmazione effettuata con detta prima molteplicità di soft-programmazione sia minore o uguale ad una corrente di soglia.
 - 8. Metodo di soft-programmazione secondo la rivendicazione 6 o 7, in cui la detta corrente di soglia è pari alla massima corrente, disponibile per le operazioni di scrittura, che può essere generata all'interno del dispositivo di memoria.

20

25

9. Dispositivo di memoria non volatile cancellabile elettricamente (1), caratterizzato dal fatto di comprendere mezzi di soft-programmazione (100-430) operanti con una prima molteplicità di soft-

programmazione in determinate condizioni operative e con molteplicità di soft-programmazione una seconda prima di softmolteplicità differente dalla dette determinate programmazione nel caso in cui condizioni operative non risultino presenti.

5

- 10. Dispositivo di memoria secondo la rivendicazione 9, in cui la detta prima molteplicità di soft-programmazione è maggiore di quella utilizzata per la scrittura di dati nel dispositivo di memoria.
- 11. Dispositivo di memoria secondo la rivendicazione 9 o 10, in cui la prima molteplicità di soft-programmazione è doppia rispetto a quella utilizzata per la scrittura di dati nel dispositivo di memoria.
- 12. Dispositivo di memoria secondo una qualsiasi delle rivendicazioni da 9 a 11, in cui la seconda molteplicità di soft-programmazione è minore della prima molteplicità di soft-programmazione.
- 13. Dispositivo di memoria secondo una qualsiasi
 20 delle rivendicazioni da 9 a 12, in cui la seconda
 molteplicità di soft-programmazione è uguale a quella
 utilizzata per la scrittura di dati nel dispositivo di
 memoria.
- 14. Dispositivo di memoria secondo una qualsiasi 25 delle rivendicazioni da 9 a 13, in cui la prima

molteplicità di soft-programmazione viene utilizzata nel caso in cui la corrente assorbita durante la soft-programmazione effettuata con detta prima molteplicità di soft-programmazione soddisfi una determinata relazione.

5

10

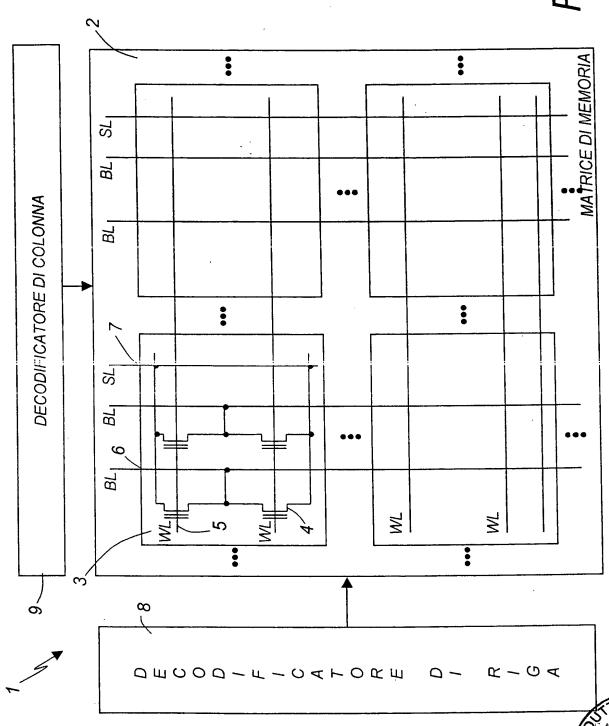
20

- 15. Dispositivo di memoria secondo la rivendicazione 14, in cui la detta relazione è definita dalla condizione che la corrente assorbita durante la soft-programmazione effettuata con detta prima molteplicità di soft-programmazione sia minore o uguale ad una corrente di soglia.
- 16. Dispositivo di memoria secondo la rivendicazione 14 o 15, in cui la detta corrente di soglia è pari alla massima corrente, disponibile per le operazioni di scrittura, che può essere generata all'interno del dispositivo di memoria.
 - 17. Metodo di soft-programmazione per un dispositivo di memoria non volatile cancellabile elettricamente e dispositivo di memoria non volatile cancellabile elettricamente implementante tale metodo di soft-programmazione, sostanzialmente come descritti con riferimento ai disegni allegati.

p. i.: STMICROELECTRONICS S.R.L

CAMERA PER TENANCE IO D INDUSTRIA ALLIBERA INTO E AGRICOLITURA DI TORINO

70 2003 A 0 0 0 17 5



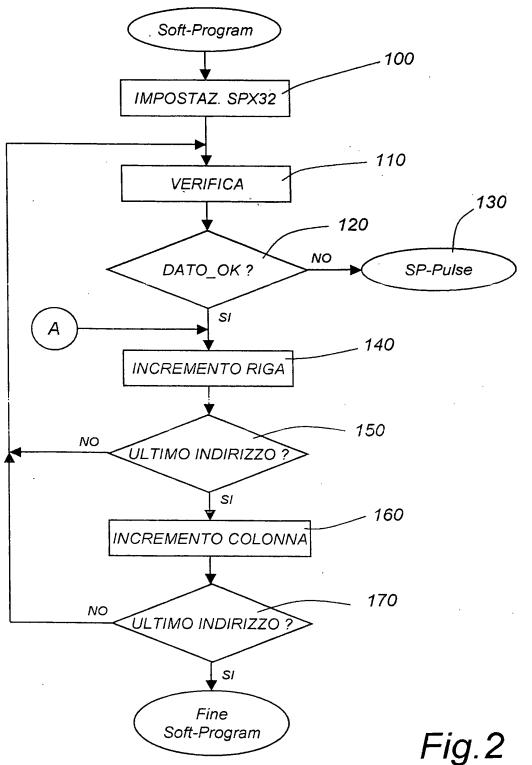
p.i.: STMICROELECTRONICS S.R.L.

BERGADANIO NIRKO

(lacritto all' Albo 11.88/38)

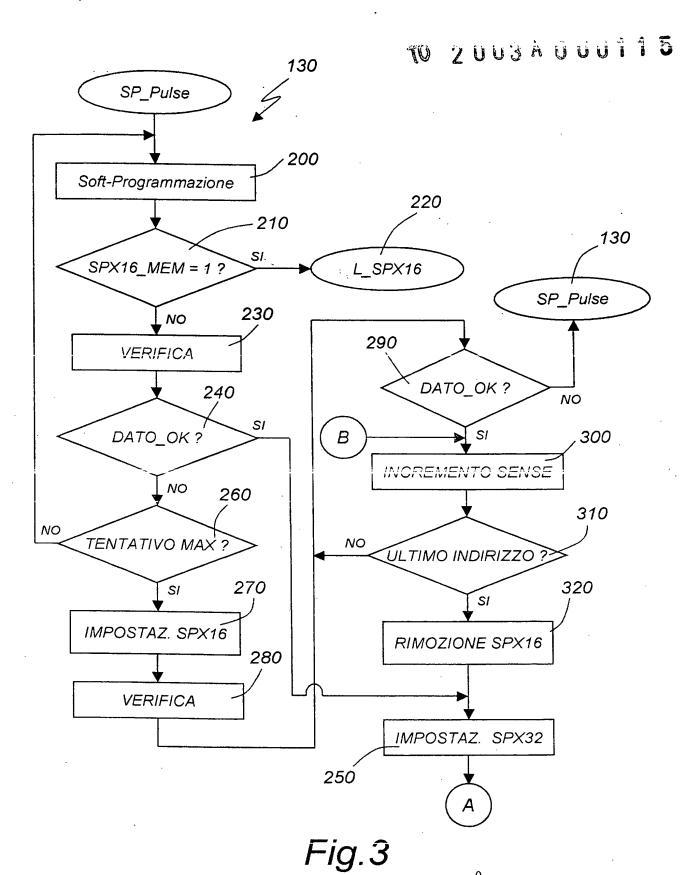
DE INDUSTRIA PROBLEMA UNO E AGRICOLTURA DI TORINO

TO 2003 A n n n 1 1 5



p.i.: STMICROELECTRONICS S.R.L. BERGADAMO MIRKO

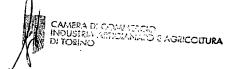




p.i.: STMICROELECTRONICS S.R.L.

BERGADASIO PAIRKO

USCRITTO ON AIDE TO BE 1381



70 2003 A 0 0 0 1 1 5

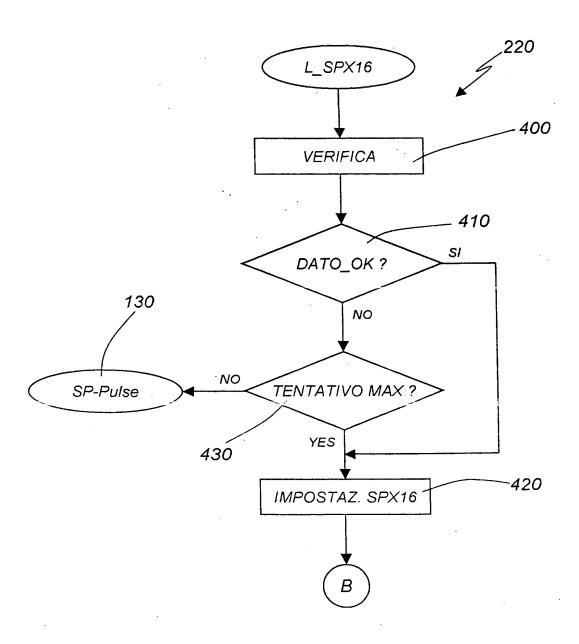


Fig.4

p.i.: STMICROELECTRONICS S.R.L.

BERGADAMO MIRKO

